

- [8] Сонин Э. Б. // Письма в ЖЭТФ. 1988. Т. 47. Вып. 8. С. 415—418.  
[9] Асламазов Л. Г., Фистулов М. В. // ЖЭТФ. 1987. Т. 93. Вып. 3 (9). С. 1081—1087.

Институт структурной  
макрокинетики АН СССР  
Московская обл.

Поступило в Редакцию  
14 июля 1988 г.  
В окончательной редакции  
12 января 1989 г.

02; 07

Журнал технической физики, т. 60, в. 1, 1990

© 1990 г.

## РЕЗОНАНСНАЯ ИНТЕРФЕРОМЕТРИЯ В ПАРАХ МЕТАЛЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОДНОЧАСТОТНОГО ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ЛАЗЕРА

А. Е. Королев, В. Н. Назаров, Д. И. Стаселько,  
Е. Ю. Кочерова, В. И. Малахова, Ю. А. Тамбьев

Методы резонансной интерферометрии широко используются в практике физического эксперимента для нахождения концентраций и визуализации неоднородностей распределения резонансно-поглощающих частиц. Для достижения предельных чувствительностей таких методов необходимо применять источники излучения с малой спектральной шириной (порядка собственной ширины резонансного перехода), плавно перестраиваемые вблизи линии поглощения [1, 2]. До последнего времени в качестве подобных источников, как правило, выступали лазеры на органических красителях.

В настоящей работе показана возможность проведения интерференционных измерений непремальных концентраций резонансно-поглощающих атомов с использованием излучения непрерывных одночастотных полупроводниковых лазеров, отличающихся от лазеров на красителях компактностью, удобством эксплуатации, простотой прецизионной перестройки частоты генерации вблизи резонанса [3], и обсуждаются особенности, возникающие при реализации высоких величин чувствительности таких методов. Применение полупроводниковых лазеров в интерференционных измерениях перспективно для решения практических задач и позволяет быстро находить условия наивысшей чувствительности методов, оперативно изменять эту чувствительность, наблюдать стационарные распределения концентраций в реальном времени.

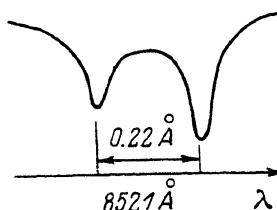


Рис. 1. Структура  $D_2$ -линии поглощения цезия.

Нами использовался инжекционный лазер ЛПН-1М на основе  $|GaAs$ , перестраиваемый при температурах  $\approx 80$  К в диапазоне  $8500—8530 \text{ \AA}$  [4], в пределах которого расположена  $D_2$ -линия поглощения цезия ( $\lambda=8521 \text{ \AA}$ ), обладающая наибольшей силой осциллятора, что позволяет реализовать предельные чувствительности интерференционных измерений. Ранее в работе [5] при исследовании плазмы цезиевой дуги использовался более слабый резонансный переход в цезии с длиной волны  $\lambda=4555 \text{ \AA}$ . Настройка длины волны генерации полупроводникового лазера на  $D_2$ -линию поглощения цезия и плавная перестройка вблизи резонанса осуществлялись, как и в [6], путем изменения тока инжекции, мощность одночастотной генерации составляла  $\approx 10$  мВт, ширина линии излучения менее  $10^{-2} \text{ \AA}$ , при этом разрешалась дублетная структура линии поглощения  $\Delta\lambda=0.22 \text{ \AA}$ , обусловленная сверхтонким расщеплением основного состояния (рис. 1).

Цилиндрическая кювета длиной 3 см, равной ее диаметру, содержавшая насыщенные пары цезия и буферный газ гелий при давлении последнего 20 Тор (величина однородного уширения компонент  $\delta\lambda=10^{-2} \text{ \AA}$  [7]), помещалась в одно из плеч интерферометра Маха—Цандера, освещаемого коллимированным пучком излучения лазера, и прогревалась в диапазоне температур  $65—90$  °C. Картина полос конечной ширины наблюдалась на выходе интерферометра на непрозрачном экране с помощью телевизионной установки МТУ-1. Для калибровки чувствительности метода регистрировалась величина сдвига картины полос при перестройке длины волны генерации лазера через  $D_2$ -линию поглощения цезия. Макси-

мальный сдвиг наблюдался на внешних крыльях компонент при отстройках от резонансов  $0.1-0.2 \text{ \AA}$ , его величина возрастила от 0.5 до 3 полос при увеличении концентрации атомов от  $2 \cdot 10^{12}$  до  $10^{13} \text{ см}^{-3}$  (рис. 2). В области аномальной дисперсии и между компонентами дублета наблюдение полос было затруднено из-за сильного поглощения излучения, проходящего через кювету.

Оценка предельной чувствительности определения концентрации цезия при указанной выше однородной ширине компонент линий поглощения, выполненная, согласно [1], без учета влияния излучения на резонансные атомы, дает величину  $\approx 2 \cdot 10^{11} \text{ см}^{-3}$  для сдвига картины интерференции на одну полосу ( $\Delta k=1$ ), что приблизительно на порядок отличается от экспериментальных данных (рис. 2). Отметим, что плотность мощности зондирующего кювету излучения составляла  $\approx 0.5 \text{ мВт/см}^2$ . Этого значения оказывается достаточно для проявления в рассматриваемых условиях эффекта насыщения поглощения резонансных атомов, связанного с перераспределением атомов по уровням и снижающего чувствительность интерференционных измерений, поскольку насыщение поглощения приводит к возникновению нелинейных фазовых набегов зондирующей волны, зависящих от ее интенсивности и имеющих обратный знак по отношению к линейному набегу фаз в среде атомов. Особенно сильно обсуждаемый эффект проявляется для частиц, имеющих сверхтонкое расщепление нижних уровней. В такой системе возникает явление оптической накачки, приводящее к перераспределению атомов по подуровням основного состоя-

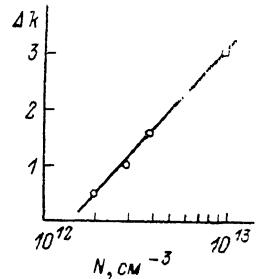


Рис. 2. Зависимость максимального сдвига картины интерференции при перестройке длины волны генерации лазера через  $D_2$ -линию поглощения цезия от концентрации атомов.

ния под действием даже очень слабого светового потока и вызывающее уменьшение населенности подуровня, с которого идет поглощение и значительное просветление слоя паров [8].

Эффекты оптической накачки для таких частиц могут быть описаны в рамках модели трехуровневых атомов при учете резонансного взаимодействия излучения с одним из переходов дублета (сверхтонкие компоненты полагаются однородно уширенными и хорошо разрешенными) для невысоких интенсивностей излучения  $I < 1/(r c_0 \tau)$  (вероятность вынужденных переходов мала по сравнению с вероятностью спонтанных оптических переходов), что практически всегда выполняется при использовании полупроводниковых лазеров,  $c_0$  — сечение поглощения переходов (считаются одинаковыми) и  $\tau$  — радиационное время жизни атомов в возбужденном состоянии. Решение системы стационарных уравнений баланса населенностей в этом случае дает выражение для рефракции атомов вблизи компоненты линии поглощения в виде, подобном [1],

$$n - 1 = \frac{C' \lambda_0^3 N f (\lambda - \lambda_0)}{(\lambda - \lambda_0)^2 + \left(\frac{\delta\lambda}{2}\right)^2 \left(1 + \frac{c_0 I T}{2}\right)},$$

где  $C' = 2.24 \cdot 10^{-14} \text{ см}$ ,  $\lambda - \lambda_0$  — отстройка длины волны генерации лазера от центра компоненты,  $\delta\lambda$  — величина однородного уширения компоненты,  $f$  — сила осциллятора,  $N$  — концентрация атомов на подуровне, с которого идет поглощение.

Время релаксации разности населенностей подуровней основного состояния  $T$  определяется временем диффузии атомов через пучок лазерного излучения или между стенками кюветы и составляет при давлениях буферного газа от единиц до нескольких десятков торр величину  $10^{-1}-10^{-3} \text{ с}$  [9]. Следствием просветления паров при оптической накачке является уширение компонент линии поглощения до величины  $\delta\lambda_T = \delta\lambda \sqrt{1 + c_0 I T / 2}$ , зависящей от интенсивности зондирующего излучения и определяющей положение экстремумов дисперсионной кривой, т. е. значение оптимальной отстройки лазера от резонанса и предельную чувствительность метода при этой отстройке по [1]. В интерферометрических экспериментах эффекты оптической накачки начинают проявляться уже при  $I > 1 \text{ мВт/см}^2$  при времени релаксации  $T \approx 10^{-2} \text{ с}$ . Аналогичным образом может изменяться чувствительность резонансной интерферометрии в случае насыщения поглощения в двухуровневых схемах переходов при использовании лазеров с большей мощностью генерации. Для резонансных переходов с типичными временами жизни  $\tau \approx 10^{-8} \text{ с}$  плотности мощности, при которых проявляется насыще-

ние поглощения, составляют  $1-10 \text{ Вт/см}^2$ . Нелинейные фазовые набеги в этом случае вычислены в [10].

В наших экспериментах компоненты уширялись до величины  $\delta\lambda_r \approx 0.07 \text{ \AA}$  (рис. 1), что дает при подстановке в (1) значение чувствительности метода  $\approx 4 \cdot 10^{12} \text{ см}^{-3}$  (с учетом относительной силы компонент), близкое к результатам эксперимента (рис. 2).

В качестве примера изучения пространственно неоднородных распределений резонансных атомов на рис. 3 представлены интерференционные картины, характеризующие распределение концентрации атомов цезия в условиях одностороннего неравномерного прогрева кюветы, создающего значительный вертикальный градиент температуры (верхняя часть кюветы находилась при комнатной температуре, нижняя прогревалась до величин  $\geq 100^\circ\text{C}$ ). Первая из интерферограмм получена при значительной отстройке от резонанса  $\lambda - \lambda_0 = 2 \text{ \AA}$  (рис. 3, a), при которой набег фазы зондирующей волны был пренебрежимо мал, вторая — вблизи резонанса  $\lambda - \lambda_0 \approx 0.2 \text{ \AA}$  (рис. 3, б) при отстройке, близкой к оптимальной (исходное искривление полос обусловлено окнами кюветы). Из рис. 3, a, б четко видно изменение ориентации полос в нижней части интерференционной картины, свидетельствующее о наличии

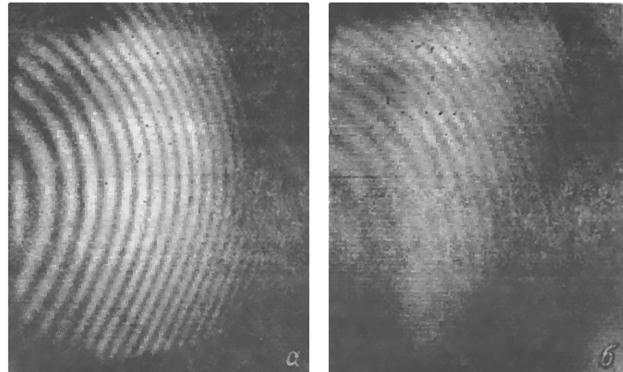


Рис. 3. Интерферограммы, характеризующие неоднородное распределение концентрации цезия (вертикальный градиент концентрации).

сильной вертикальной неоднородности концентрации. Расшифровка интерферограмм с использованием калибровочного графика (рис. 2) показывает, что концентрация атомов цезия меняется по высоте кюветы более чем на порядок (от  $10^{12}$  до  $2 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$ ), экспоненциально уменьшаясь с ростом расстояния от нагреваемой поверхности. Укажем также, что при прогреве кюветы в термостате, использованном ранее в экспериментах по динамической голограммии в парах металлов [4], с помощью которого в данной работе производилась калибровка чувствительности метода, сдвиг полос при перестройке через резонанс был одинаков во всем исследуемом сечении кюветы с точностью не хуже  $0.2k$ , что свидетельствует о высоком оптическом качестве резонансных сред при их использовании в динамических голографических элементах.

Таким образом, показано, что использование излучения одночастотного полупроводникового лазера позволяет реализовать высокочувствительные интерференционные измерения малых концентраций резонансно-поглощающих частиц. Возможность легко осуществимой перестройки длины волны генерации таких лазеров в периодическом режиме позволяет автоматизировать процесс измерения абсолютных значений концентрации, в том числе меняющейся во времени, путем фотоэлектрического счета пробегающих полос. Предельная чувствительность резонансной интерферометрии в случае трехуровневых атомов со сверхтонким расщеплением основного состояния может ограничиваться процессами оптической накачки даже при сравнительно невысоких плотностях мощности зондирующего излучения, начиная с  $1 \text{ мкВт/см}^2$ . Следует отметить возможность использования для интерференционных измерений непрерывных полупроводниковых лазеров, освоенных отечественной промышленностью, которые могут генерировать при комнатных температурах одночастотное излучение мощностью до  $5 \text{ мВт}$  в диапазоне  $760-920 \text{ нм}$ , перекрывающим резонансные линии поглощения не только цезия, но также калия и рубидия [11].

## Список литературы

- [1] Островский Ю. И., Бутусов М. М., Островская Г. В. Голографическая интерферометрия. М.: Наука, 1977. 336 с.
- [2] Дрейден Г. В., Зайдель А. Н., Островская Г. В. и др. // Физика плазмы. 1975. Т. 1. С. 462—482.
- [3] Ривлин Л. А., Семенов А. Т., Якубович С. Д. Динамика и спектры излучения полупроводниковых лазеров. М.: Радио и связь, 1983. 208 с.
- [4] Малахова В. И., Ривлин Л. А., Тамбиров Ю. А., Якубович С. Д. // Квантовая электроника. 1980. Т. 7. № 6. С. 1252—1256.
- [5] Мирзабеков А. М., Митрофанов Н. К., Островский Ю. И., Шедова Е. Н. // ЖТФ. 1981. Т. 51. Вып. 10. С. 2038—2042.
- [6] Королев А. Е., Назаров В. Н., Стаселько Д. И. и др. // Опт. и спектр. 1986. Т. 61. Вып. 5. С. 919—921.
- [7] Bernabeu E., Alvarez J. M. // Phys. Rev. A. 1980. Vol. 22. N 6. P. 2690—2695.
- [8] Harper W. // Rev. of Modern Phys. 1972. Vol. 44. N 1. P. 169.
- [9] Beverini N., Minguzzi P., Strumia F. // Phys. Rev. A. 1971. Vol. 4. N 2. P. 550—555.
- [10] Королев А. Е., Стаселько Д. И. // ЖТФ. 1984. Т. 54. Вып. 2. С. 314—322.
- [11] Жмудь А., Дуб А., Матыко Ю., Морозова Г. // Радио. 1986. № 10, 11.

Поступило в Редакцию  
11 июля 1988 г.

10

Журнал технической физики, т. 60, в. 1, 1990

© 1990 г.

## ВОЗБУЖДЕНИЕ МЕДЛЕННЫХ ЦИКЛОТРОННЫХ ВОЛН В ЭЛЕКТРОННОМ ПУЧКЕ С ПОМОЩЬЮ РЕЗОНАТОРА *H*-ТИПА

В. Г. Гапанович, Б. И. Иванов, М. И. Капчинский, Р. А. Мещеров,  
П. В. Миронов, В. С. Рыбалко, А. А. Савенко, В. Д. Сажин, Л. А. Юдин

Возбуждение медленной циклотронной волны (МЦВ) в сильноточном электронном пучке является важным этапом в разработке метода коллективного ускорения ионов, основанного на предложении М. Слоана и В. Драммонда [1]. Первое сообщение об экспериментальных исследованиях по возбуждению азимутально-симметричной МЦВ в пучках малой мощности появилось в [2]. Волны большой амплитуды ( $\sim 10$  МВ/м), но весьма малой длительности ( $\sim 60$  нс) были получены в Остине (США) [3]. В этих экспериментах возбуждение МЦВ проходило при взаимодействии пучка с отрезком спирального волновода и использованием внешнего генератора СВЧ мощности.

Между тем циклотронные волны пучка неоднократно использовались для генерации СВЧ излучения в приборах типа мазера на циклотронном резонансе (см., например, [4]), основанных на взаимодействии пучка с резонаторными структурами, возбуждаемыми на колебаниях *H*-типа. Как известно, условие циклотронного резонанса

$$\omega - k_z u = n\Omega,$$

где  $\omega$  — частота резонатора;  $\Omega = eB_0/\gamma mc$  — циклотронная частота;  $e$ ,  $m$  — заряд и масса покоя электронов;  $c$  — скорость света;  $B_0$  — продольное магнитное поле;  $\gamma$  — релятивистский фактор;  $k_z$  — продольное волновое число;  $u$  — скорость пучка, которая в таких приборах сводится к  $u \approx n\Omega$ , так что взаимодействие пучка происходит с однородными модами резонатора ( $k_z = 0$ ).

Для возбуждения МЦВ ( $\omega \ll k_z u$ ) условие резонанса  $k_z u \approx \Omega$ , наоборот, требует работы на модах с сильной пространственной вариацией. Заметим также, что для целей СВЧ генерации необходимы резонаторы с низкой радиационной добротностью, что определяет выбор открытых резонаторов. Для возбуждения МЦВ разумнее использовать закрытые высокодобротные резонаторы, что позволяет снизить стартовый ток.

В работе приводятся результаты эксперимента по возбуждению МЦВ микросекундной длительности при взаимодействии сильноточного электронного пучка с пассивным закрытым резонатором *H*-типа, периодически нагруженным трубками дрейфа.